

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Description of the PA - 14.201, 101, 901 modules IAEA, 1984.
2. Low level processing of diode spectrometry J. Cl. Philippot 1975 "International conference on low level measurement and application. Tatrantska Lomnicka, (Tiệp khắc), 10.10.1975".
3. Во Дац Банг, Чанг Динь Куок. К применению комбоционного анализа при изолированного пика - амплитудном распределении. Сообщение оххи, Дубна 10 - 408.

Tran Manh Toan, Nguyen Trieu Tu - THE GAMMA SPECTROMETER DK - 1024

The description of the gamma spectrometer DK - 1024 is given. The spectrometer can be used for three types of analysis: 1) Activation analysis; 2) Fluorescence analysis; 3) Whole body natural gamma measurement.

Viện 481 VNLNTQG

Bộ môn VLHNTN - DHTH Hà Nội

Nhận ngày

ĐIỆN TRỞ SUẤT ρ , VÀ SỬ DỤNG NÓ KHI PHÂN TÍCH TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP TRƯỜNG CHUYỀN

NGUYỄN AN, LÊ VIẾT ĐỨC KHOA

Phương pháp trường chuyển là một phương pháp thăm dò điện dòng biến đổi để xác định các vùng dây thu phát không nối đất, người ta kích thích môi trường đất đá bởi tia điện tử dạng xung và ghi lại hoặc suất điện động cảm ứng thứ cấp ϵ (ti) hoặc thông lượng qua vòng dây thu ϕ (ti) tại các thời điểm ti khác nhau sau khi ngắt xung phát. Từ các tia này, người ta đưa ra các phương pháp phân tích khác nhau nhằm dự đoán, mô tả môi trường bên dưới.

Thứ nhất, người ta coi phương pháp này như là một phương pháp mặt cắt và các đường cong ρ (ti) / ϕ (ti) / I trên tuyến khảo sát để dự đoán sự tồn tại vật chất bên dưới. Sau đó người ta xem phương pháp trường chuyển như một phương pháp do sâu theo nguyên lý Skin, khi tăng thời gian trễ, trường điện từ ghi nhận được sẽ phản ánh phân bố của môi trường theo độ sâu tăng dần.

Như vậy các đường cong $\rho_K(t)$ hoặc $\sigma_K(t)$ là các đường cong do sâu và lát cắt đất chung trên tuyến khảo sát hoàn toàn phản ánh một cách định tính phân bố, các tham số trong không gian môi trường khảo sát. Ở đây:

$$\rho_K(t) = \frac{1}{\sigma_K(t)} = \frac{J^{2/3} \mu^{6/3} \pi^{1/3} R^{8/3}}{20^{2/3} t^{5/3} \epsilon^{2/3}}$$

Tuy nhiên, ta cần tìm mối liên hệ định lượng giữa thời gian trễ ta và độ sâu nghiên cứu. Để có nhiều tác giả đưa ra giá thiết khác nhau về mối liên hệ đó. Ở đây chúng tôi sử dụng mối liên hệ giữa độ sâu hữu dụng s và thời gian trễ t của F. M. Kamencheski [1]:

$$Z = K \sqrt{\frac{t}{\sigma_K \mu}} = K \sqrt{\frac{t \rho_K}{\mu}}$$

K là hệ số phụ thuộc cấu trúc hình học của môi trường khảo sát (có phương pháp xác g). Nhờ công thức (2) chúng ta có thể biểu diễn sự phụ thuộc các tham số địa diện theo Nghĩa là các lát cắt đẳng trị $\rho_r(z)$, $\sigma_K(z)$ phản ánh phân bố không gian độ dẫn điện (trở suất) của môi trường khảo sát. Cách biểu diễn như vậy chính xác hơn cách biểu t.

ng dùng tham số $\rho_r(z)$ hoặc $\sigma_K(z)$ còn chưa phản ánh đúng dẫn điện trở suất thực cùn g. Để tìm phương pháp biểu diễn tốt hơn, chúng ta đưa vào tham số điện trở xuất ρ_z . Ng tự như điện trở suất Pétropski trong phương pháp dòng không đổi, điện trở suất ρ_z gần với điện trở suất thực của môi trường hơn ρ_r . Muốn vậy, cần tìm mối liên hệ giữa P. M. Kamencheski đưa ra giả thiết về mối liên hệ sau đây giữa độ dẫn suất biểu kiến σ_K và suất σ_z (trong môi trường đẳng hướng $\sigma_z = 1/\rho_z$):

$$\sqrt{\sigma_K} = \frac{1}{Z} \int_0^Z \sqrt{\sigma_z} dZ \quad (3)$$

ghia vật lý của công thức (3) là: Căn của độ dẫn suất biểu kiến σ_K như là giá trị trung cǎn độ dẫn suất σ_z từ độ sâu z đến mặt đất.

iện lợi so sánh với tài liệu các phương pháp điện khác, & đây chúng tôi dùng biểu diễn cho σ_z . Từ công thức (1) và (3) dễ dàng suy ra:

$$\frac{Z}{\sqrt{\rho_r}} = \int_0^Z \frac{dZ}{\sqrt{\rho_r}} \quad (4)$$

$$\rho_z = \frac{1}{\left[\frac{d}{dz} \left(\frac{z}{\sqrt{\rho_r}} \right) \right]^2} \quad (5)$$

ng tôi đã tiến hành lập chương trình để tính toán và thể hiện các kết quả phân tích trên inh loại AT. Bằng bộ chương trình vẽ Sufer, chúng tôi thể hiện các kết quả phân tích sơ đồ lên màn hình. Nhờ vậy kết quả phân tích có thể nhìn thấy ngay. Tính toán các và tích phân số (trong công thức (5) và hệ số K trong công thức (2)), chúng tôi sử dụng ian xấp xỉ Splai.

ng tôi đã tiến hành phân tích các tài liệu trường chuyển do trên các mỏ sắt Thạch Khê, p lai, Ba trại, đồng Tạ khoa, Đa kim Đá liền và chì kẽm Chợ điền. Để minh họa chúng trong số các mặt cắt đã phân tích.

inh vẽ 1: Nếu kết quả phân tích tài liệu trường chuyển tuyến 80 mỏ sắt Thạch khê. Ta iệ thống các đường cong $\rho_z(z)$ phản ánh các cực trị sâu hơn và qua các ranh giới quặng hạch vây quanh sự biến đổi của đường cong rõ nét hơn đường cong $\rho_r(t)$.

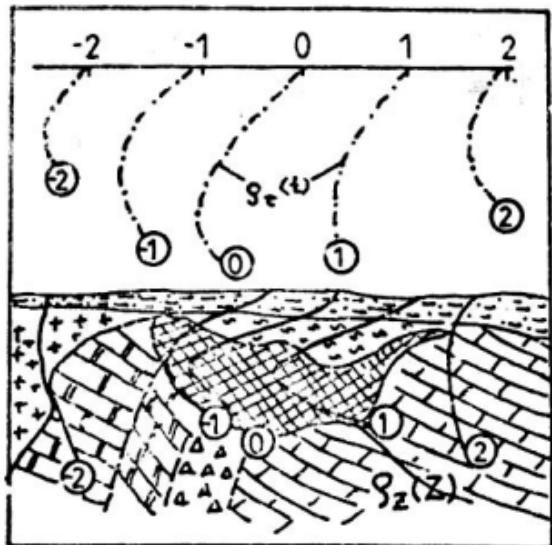
inh vẽ 2: Nếu kết quả phân tích trên tuyến 60 vùng mỏ Đa kim Đá liền. Ta thấy rõ lát tri $\rho_z(z)$ phản ánh thân quặng khá tốt. Các đường đẳng trị $\rho_z(z)$ cho phép mô tả hình sâu, thể nǎm thân quặng phù hợp tài liệu địa chất. Trong khi đó lát cắt đẳng ôm $\rho_r(z)$ quá kẽm hơn.

các kết quả trên chúng tôi rút ra kết luận sau:

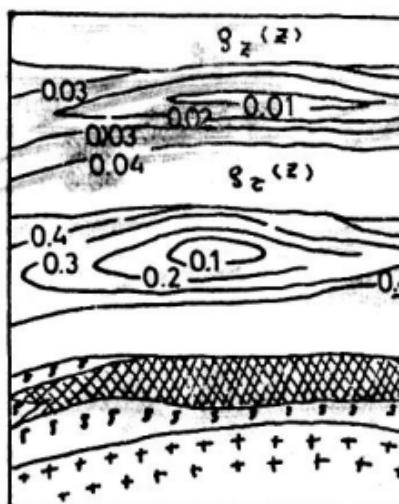
dụng điện trở suất ρ_z để phân tích tài liệu trường chuyển cho kết quả chính xác hơn, ơn theo ρ_r .

ân tích các lát cắt đẳng trị $\rho_z(z)$ cho ta nhận đoán hình dạng, quy mô, thể nǎm của thân kết quả nhận được phù hợp thực tế hơn lát cắt $\rho_r(t)$ hay $\rho_r(z)$.

a ranh giới quặng và nhám thạch vây quanh, điện trở suất ρ_z biến đổi rõ hơn ρ_r . Do ân tích các đặc trưng biến đổi, đáng diệu và các giá trị cực trị của hệ thống đường cong n tuyến khảo sát, chúng ta có thể dự đoán được vị trí quặng, các ranh giới địa chất khác.



Hình 1



Hình 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ф. М. Каменецкий. Приклад. геофиз. вып. 97, 80, (1980).

Nguyễn An, Lê Việt Du Khuong – THE RESISTANCE ρ_z AND ITS USE FOR INTERPRETING DATA OBTAINED BY TRANSIENT METHOD

The use of the resistance ρ_z in processing and interpretation of data obtained by transient method is a new problem. As the petrovski resistance (ρ_p), resistance ρ_z has value approximated to real resistance of the rock and more the apparent resistance ρ_r . In comparison with the use of apparent resistance ρ_r , interpretation of transient data, the use of ρ_z gives the high accuracy.

Lиэн đoàn VLDC

Bộ mìn ĐVL - DHTH Hà nội

Nhận ngày 20.3.199